

## 出展のご案内

# 「第28回 インターフェックス Week 東京」

拝啓

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
このたびフクダは「第28回 インターフェックス Week 東京」への出展に際し、  
容器完全性試験(CCIT)に準ずる全数検査装置と抜き取り検査機を展示をいたします。  
ご多忙中のところ恐れ入りますが、この機会に是非ともご来場いただきたくご案内申し上げます。

敬具

会 期：2026年5月20日(水)～22日(金) 10:00～17:00  
会 場：幕張メッセ 8ホール ブースNo. 41-36

### ■出展製品

#### 包装容器 全数ピンホール検査装置 MSQ-2003 series

ピロー包装等を対象としたパッケージの完全性を検査する全数検査装置です。パッケージに生じるピンホールや溶着剥がれといった包装不良を検知します。

- ◆処理能力 60 個/分、検出能力  $\phi 50 \mu\text{m}$  のピンホールを検知可能なインライン装置
- ◆定量的で、再現性のある測定が可能
- ◆対象はピロー包装の容器等



#### 包装容器 エアリークテスト装置 MSP series

医薬品梱包の包装不良を検出するための卓上型完全性試験(CCIT)装置です。パッケージの完全性を検査することで製品本体の品質保持が可能となり、水没による廃棄の無駄が無くなります。

- ◆GMP、DI、バリデーション対応
- ◆バリア性の確認(酸素、水蒸気等)
- ◆「最大許容漏れ限度」の設定
- ◆定量的・再現性のある測定結果
- ◆液漏れ計測が可能



### ■ご来場のご案内

ご来場の前に展示会公式サイトにて「事前登録」が必要となります。下のQRコードから登録を完了して下さい。



事前登録サイト

(ご参考動画)

受付方法  
(来場バッジ発行の流れ)